新博士紹介

1.	氏名 岩崎剛之(株式会社 東芝 デジタルメディア						
ネットワーク社)							
2.	論 文提出大学 大阪大学						
3.	学位種類 博士(理学)						
4.	取得年月日 2001年3月						
5.	題目 High Energy Spectroscopic Studies of Ce Com-						
pounds(Ce 化合物の高エネルギー分光による							
	研究)						
6.	使用施設(ビームライン) SPring-8 BL25SU, KEK						
	-PF BL-3B, 11D						

7. 要旨

[序]

Ce 化合物は様々な興味深い物性を示すことで知られ, 長年固体物理学の重要なテーマの一つとなってきた。ま た,その物性は1個の4f電子が担うとされ、よってCe 化合物の物性を解明するためには Ce 4f 電子状態の情報は 必要不可欠なものである。Ce4f電子状態を調べるには, 放射光を利用した Ce4d-4f 共鳴光電子分光法 (Ce4d-4f RPES),あるいは比較的新しいCe3d-4f共鳴光電子分光 法(Ce3d-4f RPES)が用いられる。これまで行われた Ce4f 電子状態の研究には、利用できる放射光の特性や分 解能の問題から、低エネルギー(比較的表面敏感な) Ce4d-4f RPES がよく用いられてきた。ところが近年,表 面領域とバルク領域でCe4f電子状態が大きく異なってい ることが指摘された1)。一般に、バルク情報を多く含むと される Ce3d-4f RPES は励起光のエネルギーが相対的に 高い(約880 eV)ために、そのエネルギー分解能も Ce4d -4f RPES の約40 meV と比べ,一桁悪い約500~700 meV であった。よって,これまで表面領域とバルク領域で Ce4f 電子状態が大きく異なっていることは分かったもの の、それらの詳細な比較・議論ができなかった。

以上のような状況の中で最近 SPring-8 が完成し,高分 解能でかつ高エネルギーな励起光が利用可能になった。そ こで,上記問題を解決すべく Ce 化合物の高分解能 Ce3d-4f RPES を行った。本研究では,様々な特異な物性を示 すことで知られるプニクトゲンを含む,新物質 CePdX (X=P, As, Sb)の Ce 4f 電子状態を調べた。特に,実験 結果を理論解析することによってバルクと表面の電子状態 に分離し,その電子状態の違いを詳細に調べた。 [実験]

バルク電子状態は,SPring-8のBL25SUにおいて高分 解能 Ce 3*d*-4*f* RPES を行うことで調べられた。一方,表 面電子状態は,KEK-PFのBL-3BおよびBL-11Dにお いて,高分解能 Ce4*d*-4*f* RPES によって調べられた。そ れぞれの分解能は Ce3*d*-4*f* RPES が *hv*~880 eV において ΔE ~100 meV であり,一方,Ce4*d*-4*f* RPES は約120 eV 前後の光で ΔE ~40 meV であった。



Figure 1. Left panels: Ce 3d-4f resonance photoemission spectra (RPES) of CePdX (X=P, As, Sb) in comparison with the Ce 4d-4f RPES. Right panels: Comparison of the resonance-minimum spectra of CePdX taken at $hv \sim 875$ eV and 114 eV, representing the non -4f valence-band structures. The spectral weight of the resonance-maximum to -minimum spectra is arbitrary.

[結果と考察]

Figure 1の左側のパネルは Ce4f スペクトルの励起エネ ルギー依存性を示している。図より,バルク敏感なスペク トル (Ce3*d*-4*f* RPES) と表面敏感なスペクトル (Ce4*d*-4*f* RPES) が 3 つの化合物全てにおいて大きく異なってい ることが分かる。また,これらのスペクトルは, $A \ge B$ の 2 つのピーク構造からなっており,これらのピークは Ce4*f* 電子状態が周りの軌道と混成することによってでき た結合状態(*B*) と反結合状態(*A*)に起因している。全ての 化合物に対して,表面敏感な Ce4*d*-4*f* スペクトルからバ ルク敏感な Ce3*d*-4*f* スペクトルに変化することで,ピー ク*A* に対するピーク*B* のピーク強度比 (*I_B*/*I_A*) が大きく なっていることがわかる。これは表面領域よりバルク領域 における混成の方が強いことを表している。

ー方, Fig. 1 の右側のパネルは,価電子帯のスペクト ル (Ce(5d)¹, Ce(6s)², Pd(4d)¹⁰, X(p)³) を表している。 これらのスペクトルは,励起光のエネルギーを約875 eV (Ce3d-4f RPES) と約114 eV (Ce4d-4f RPES) に合わ せることにより,Ce4f からの放出をほとんど打ち消すこ と(共鳴極小)によって得ている。クロスセクションを考 慮するとこれらのスペクトルには Pd4d 軌道からの寄与が 大きく反映されている。実験結果において,表面とバルク 領域のスペクトル間に違いが見られるが,これは Pd4d 軌 道が114 eV 付近において Cooper minimum に相当するた めに,表面領域のスペクトルにおいて Pd4d の放出がかな CePdP

hv = 875 e

CePdAs

CePdSb

5

intensity (arb. units)

CePdP hv= 114 eV

CePdAs

CePdSb

Figure 2. The resonance-minimum spectra for CePdX (X=P, As, Sb) taken at the Ce 3d and 4d thresholds compared with the results of the band-structure calculation for LaPdX (X=P, As, Sb). The band-structure calculations are broadened by a Gaussian and a Lorentzian function, considering the relative photoionization cross sections.

010

binding energy (eV)

り抑えられていることに起因していると考えられる2)。

以上のことを確かめるために、これらの価電子帯スペク トルとLaPdX (X=P, As, Sb) に対してなされたバンド 計算とを比較した (K. Takegahara, H. Harima, T. Oguchi との共同研究による)。Figure 2 の左側のパネルはバルク 領域の価電子帯スペクトルであり、右側のパネルは表面領 域の価電子帯スペクトルを表す。計算結果(実線)は、各 軌道に対してなされたバンド計算の結果に対して、励起光 のエネルギーに依存した各軌道のクロスセクション、光電 子放出によってできた正孔の寿命および装置の分解能を畳 み込んで得られたものである。Figure 2 より、実験結果 と計算結果はほぼ一致していることが分かる。よって、こ れらの化合物において、価電子帯における表面領域とバル ク領域のスペクトル間の違いは、主に各軌道間(特に、 Pd4d)の光電子放出におけるクロスセクションの違いに よるものと考えられる。

次に、不純物アンダーソンモデルに基づいた non-crossing approximation (NCA) 法を用いて、実験で得られた Ce4f スペクトルを再現することを試みる³⁾。この NCA 計 算法は、各束縛エネルギーにおける混成強度(混成強度の エネルギー依存性: $\rho V^2(E)$)をパラメータとして利用で きるという特徴を持つ。また、この解析においては表面第 一層を表面成分とし、第二層以下をバルク成分と仮定し た。これにより、Ce3d-4f RPES(hv~880 eV)スペクト ルにおける表面成分とバルク成分の比 I_s/I_b は~0.28であ



Figure 3. Comparison of the Ce 4f spectrum studied by the 3d-4f (left panels) and 4d-4f (right panels) RPES with the calculated spectra for CePdX (X=P, As, Sb).

Table 1. Parameters used in the NCA calculation for bulk (a) and surface (b) components and n_f obtained by this analysis.

(a) Bulk							
	$(\overset{\boldsymbol{\epsilon}_{f}}{\mathrm{eV}})$	$(\mathrm{eV}^{\mathcal{E}_p})^{(\mathrm{a})}$	${\rho V^2 \ (E_{\rm F}) \over ({\rm meV})^{({\rm b})}}$	$\delta ({ m meV})^{({ m c})}$	n_f		
CePdP (bulk)	1.7	2.0	4.5	64	0.9965		
CePdAs (bulk)	1.6	2.3	3.2	56	0.9967		
CePdSb (bulk)	1.7	2.1	4.0	57	0.9968		
(b) Surface							
	$(\overset{\boldsymbol{\epsilon}_{f}}{\operatorname{eV}})$	$(\mathrm{eV}^{\mathcal{E}_p})^{(\mathrm{a})}$	$\begin{array}{c} \rho V^2 \; (E_{\rm F}) \\ ({\rm meV})^{ ({\rm b})} \end{array}$	$\overset{\pmb{\delta}}{(\mathrm{meV})^{(\mathrm{c})}}$	n_f		
CePdP (surface)	2.7	2.0	4.0	57	0.9979		
CePdAs (surface)	2.7	2.3	2.4	42	0.9980		
CePdSb (surface)	2.7	2.1	2.5	36	0.9981		

 $^{(a)}\,$ Highest position of the energy distribution $\rho V^{2}\,\left(E\right) .$

^(b) The values of $\rho V^2(E)$ just at the Fermi level.

^(c) The average of the hybridization strength defined as the following:

$$\delta = \pi \int_0^{\mathrm{B}} \frac{\rho V^2(E)}{B} \, dE$$

(B represents the valence-band width in eV)

り,一方, Ce4*d*-4*f* RPES (hv~120 eV) における表面と バルクの比 I_s/I_b は~1.33と見積もることができた⁴)。

Figure 3は,**Table 1**に示したパラメータおよび **Fig. 4**に示した混成強度のエネルギー依存性を用いて,Ce4*f* スペクトルを再現したものである。**Figure 3**のように, Ce3*d*-4*f* RPES および Ce4*d*-4*f* RPES によって得られた



Figure 4. Partial density of states of the pnictogen X p states of CePdX (X=P, As, Sb) are compared with the optimized $\rho V^2(E)$ employed in the non-crossing calculation for represented by the solid (dashed) lines for the bulk (surface) component.

全ての化合物に対する Ce4f スペクトルをほぼ再現することに成功した。また同時に、表面とバルクの Ce4f スペク

トルの分離にも成功した。**Figure 4**より、表面とバルク 領域でのスペクトルの違いは、混成強度のエネルギー依存 性の違いよりむしろ 1 eV 近く離れた ε_f の違いに起因して いることが分かった。

本研究では、CePdX (X=P, As, Sb) に対して、Ce4*d* -4*f* RPES と同等の高分解能でバルク敏感なCe3*d*-4*f* RPES を行った。この結果をNCA 計算を用いて詳細に解析することにより、Ce4*f* 電子状態の表面およびバルク電子状態に分離することに成功した。またこの結果は、不純物アンダーソンモデルが少なくともこれらの近藤系 Ce 化合物 (近藤温度 $T_{\rm K}$ ~数 K) に対して充分に適用できることを示している。しかしながら、価数揺動系 Ce 化合物 ($T_{\rm K}$ >数100 K) に対して、不純物アンダーソンモデルが適用できるどうかはまだ議論が分かれており、近藤共鳴 ピークの振る舞いを含めて今後より系統的な研究が必要である。

参考文献

- 1) C. Laubschat et al.: Phys. Rev. Lett. 65, 1639 (1990).
- 2) J. J. Yeh et al.: At. Data Nucl. Data Tables 32, 1 (1985).
- 3) Y. Kuramoto: Z. Phys. 53, 37 (1983).
- 4) S. Tanuma et al.: Surf. Sci. 192, L849 (1987).

(受付番号01069)